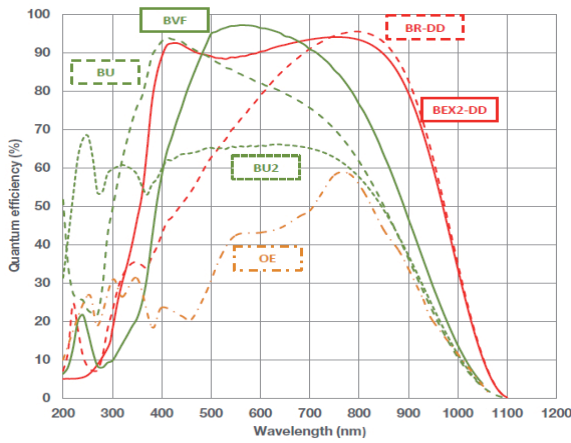
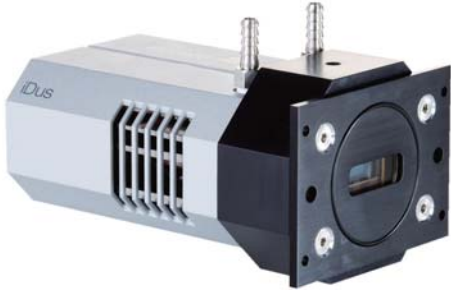


iDus 420 系列光谱 CCD 探测器



iDus 420 量子效率曲线

iDus 420 系列深度制冷科学级光谱 CCD 基于 1024×255 规格 CCD 芯片，包含多种选项来满足不同的实验需求。采用专利的真空密封技术，保证了制冷温度及耐久性。

主要特点

- 峰值量子效率 >95%
- TE 制冷，最低 -100°C
- UltraVac™ 真空密封技术，保证 5 年真空质保
- 单光窗设计，将光损失降至最低
- Fringe suppression 技术(条纹抑制)，消除背感光 CCD 的 etalon(干涉)效应
- Dual AR 双镀膜选项，同时提升紫外及近红外波段量子效率

附件选项

C 接口适配器、F 接口适配器、快门、水冷机

主要应用

探测器类型	BU/BU2	BVF	BR-DD	BEX2-DD	OE
吸收 / 透射 / 反射光谱	△	○	△	△	△
原子发射光谱	△	○	△	△	△
荧光光谱	△	○	△	△	△
近红外光谱			○	△	△
拉曼光谱 (244 ~ 488nm)	○	△			△
拉曼光谱 (514,532,633nm)	△	○	△	△	△
拉曼光谱 (785,830nm)			○	△	△
紫外 - 可见 - 近红外宽光谱				○	△

适合：△ 最佳：○

技术参数指标：

型号	DV420A	DU420A	DU420A-Bx-DD
芯片类型	BV: 背感光，可见波段优化 BU: 背感光，紫外增强 350nm 优化 BU2: 背感光，紫外增强 250nm 优化 BVF: 背感光，可见光波段优化以及消除近红外 etalon 镀膜 OE: 开放电极		BR-DD: 背感光深耗尽 CCD。带有消除近红外波段的 etalon 镀膜 BEX2-DD: 背感光深耗尽 CCD。带有消除近红外波段的 etalon 镀膜以及波段扩展双层抗反射膜
有效像素	1024×255		1024×256
像元尺寸	26μm×26μm		
探测面尺寸	26.6 mm×6.6 mm		
最大光谱采集速度	88 (10 rows crop mode), 75 (Full Vertical Bin), 65 (开放电极, Full Vertical Bin)		
线性度	>99%		
最小读出噪声	OE: <4 e ⁻ , BU, BU2, BVF: <6 e ⁻		BR-DD: <4 e ⁻
暗电流	OE: 0.0004 e ⁻ /pixel/sec @-100°C, BU/BU2: 0.002 e ⁻ /pixel/sec @-100°C, BVF: 0.002 e ⁻ /pixel/sec @-100°C		Bx-DD: 0.008 e ⁻ /pixel/sec @-100°C
最低制冷温度	-70°C	-100°C	-100°C
光窗类型	单石英窗口，无镀膜。防反射膜或 MgF ₂ 可选		BR-DD: 单石英窗口，防反射镀膜 (900nm 优化) BEX2-DD: 单石英窗口，无镀膜